— ФИЗИКА ——

УДК 537. 534

## 

# ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ИОНОВ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ, РАССЕЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЯМИ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ

Экспериментально исследована рассеяние низкоэнергетических ионов Cs + ( $E_0 = 30 \div 500 \text{ eV}$ ) на поликристаллических поверхностях Ta, W, Re и рассеяние ионов K<sup>+</sup> на поликристаллических поверхностях Ti, V, Cr в целях выявления механизма рассеяния ионов низких энергий и выяснение возможности его использования для анализа поверхностных слоев.

Интерес к исследованию взаимодействия ионов низких энергий с поверхностью твердого тела обусловлен как развитием методов диагностики поверхности ионными пучками, так и развитием технологий процессов ионной имплантации, эпитаксии, ионно-плазменного осаждения, а также необходимостью более полного понимания механизмов явлений и процессов, сопровождающих взаимодействие ион–поверхность [1–3].

В представленной статье экспериментально исследовано рассеяние ионов Cs+ на поверхностях Та, W, Re и ионов K<sup>+</sup> на поверхностях Ti, V, Cr при низких начальных энергиях ионов  $(E_0 = 80-500 \text{ } )$  для уточнения механизма рассеяния в целях возможности использования рассеяния медленных ионов для анализа поверхностных слоев материалов. Выбор материала мишеней обусловлен тем, что соотношения масс сталкивающихся частиц µ=m<sub>2</sub>/m<sub>1</sub> для обеих троек мишеней примерно равны (µ – отношение массы атома мишени m, к массе иона m,), а энергии связи атомов мишеней различаются. Углы падения  $\psi = 55^{\circ}$  и рассеяния  $\theta = 70^{\circ}$  соответствовали углу зеркального отражения. Доля сохраняемой энергии возрастает при уменьшении энергии бомбардирующих ионов.

Эксперимент. Измерение дифференциальных энергетических спектров рассеянных ионов проводили на экспериментальном приборе, обладающем высоким угловым ( $\Delta \phi$ =0,6°) и энергетическим ( $\Delta E/E$ =1/125) разрешением (энергоанализатор типа сферический дефлектор) и способном анализировать вторичные ионы по массам с помощью времяпролетной методики. Ионы щелочных металлов получали в термоионном источнике, в рабочих условиях плотность тока на мишень была 5·10<sup>-7</sup> A/см<sup>2</sup>. Энергия первичных ионов E<sub>0</sub> =30÷500 эВ. Мишени обезгаживались прогревом электронной бомбардировкой в вакууме

р=10<sup>-8</sup>−10<sup>-7</sup> Тор при температуре Т≈0,7÷0,8Т<sub>пл</sub> (плавления). В режиме измерения для нагрева мишени использовалась импульсная электронная бомбардировка, а регистрация спектров проводилась при отсутствии ускоряющего импульса электронной бомбардировки. Падающий и рассеянный пучки лежали в одной плоскости с нормалью, восстановленной к поверхности мишени в точке падения. Спектры регистрировались в режиме счета с использованием многоканального анализатора импульсов, затем обрабатывались на ЭВМ для процедуры сглаживания [4].

Результаты и их обсуждение. Экспериментально исследовано рассеяние ионов на поликристаллических мишенях Cs<sup>+</sup> на Ta, W, Re и ионов K<sup>+</sup> на Ti, V, Cr. Углы падения  $\psi$ =55° и рассеяния  $\theta$ =70° соответствовали условию зеркального отражения. На рис. 1 представлены измеренные дифференциальные энергетические спектры рассеянных ионов для пар Cs<sup>+</sup> $\rightarrow$ Ta ( $\mu$ ≅1,36), Cs<sup>+</sup> $\rightarrow$  W ( $\mu$ ≅1,38), Cs<sup>+</sup> $\rightarrow$ Re ( $\mu$ =1,40) и Ka $\rightarrow$ Ti ( $\mu$ ≅1,23), K $\rightarrow$ V ( $\mu$ ≅1,30), K $\rightarrow$ Cr ( $\mu$ ≅1,33) в интервале начальных энергий E<sub>0</sub>=80÷500 эВ при температуре мишеней T=0,8T<sub>пп</sub> K.

Видно, что форма спектров во всех случаях подобна, характеризуется пиком в области низких энергий. При уменьшении E<sub>0</sub> положения максимумов спектров для всех мишеней смещаются в сторону сохранения большей относительной энергии. Заметим, что менее всего сдвиг максимумов проявляется в случае рассеяния ионов цезия на вольфраме, а также в случае рассеяния ионов калия на ванадии.

Известно, что в случае парных упругих столкновений энергия, сохраняемая рассеянным ионом, при заданном угле рассеяния зависит от соотношения масс сталкивающихся частиц и положение максимумов энергетических спектров должно оставаться постоянным, а само положение

2007. № 2

\_\_\_\_\_ 36 \_\_\_\_\_



**Рис. 1.** Дифференциальные спектры рассеяния ионов Cs<sup>+</sup> и K<sup>+</sup> на соответствующих поликристаллических мишенях при  $E_0(3B) = 1-500, 2-400, 3-200, 4-100, 5-80$ . Штриховая линия-расчет по формуле (1)

максимумов можно определить приближенно по формуле

$$E = E_0 * \{ [\cos\theta \pm \sqrt{(m_2/m_1)^2 - \sin^2\theta} ] / / [1 + m_2/m_1] \}^2, \qquad (1)$$

где Е – энергия рассеянных частиц;  $E_0$  –энергия первичных ионов;  $\theta$  – угол рассеяния. На рис. 1 можно наблюдать сдвиг максимумов от расчетного положения. Расчеты проведены для  $\mu$ =1,3 при однократном рассеянии. Сравнение энергий связи атомов этих мишеней показывает, что наибольшими значениями энергий связи в первой тройке мишеней обладают атомы вольфрама W ( $E_{c_B}$ =8,66 эВ), во второй тройке мишеней – атомы ванадия V ( $E_{c_B}$ =5,3 эВ). Как отмечено ранее, именно для этих пар наблюдается наименьший сдвиг положений максимумов в спектрах относительно положений, рассчитанных по формуле (1).

Отметим, что в первой тройке энергия связи атомов мишени для Та ( $E_{cB}=8,089$  эВ), для Re ( $E_{cB}=8,10$  эВ). Аналогично во второй тройке для Ti ( $E_{cB}=4,86$  эВ), для Cr ( $E_{cB}=4,10$  эВ). Таким образом, мы наблюдаем, что сдвиг максимумов зависит от энергии связи атомов мишеней.

На рис. 2 и 3 представлены зависимости относительной энергии, сохраняемой рассеянными ионами  $E_m/E_0$  в максимуме кривой распределения по энергиям ионов Cs<sup>+</sup>, рассеянных поликристаллами Ta, W, Re и ионов K<sup>+</sup>, рассеянных поликристаллическими Ti, V, Cr, от начальной энергии налетающих ионов. Видно, что кривые зависимостей доли энергии, сохраняемой рассеянными ионами, от начальной энергии имеют один и тот же вид. Отметим, что во всем исследованном интервале первичных энергий  $E_0$  наблюдается существенный рост относительной энергии  $E_m/E_0$ 

= 37 ===



(E<sub>m</sub>-энергия рассеянных ионов в максимуме энергетического распределения) с уменьшением E<sub>0</sub>.

При этом кривые для мишеней с близкими значениями  $E_{cB}$  практически совпадают. Заметим также, что ниже всех расположены кривые для ванадия и вольфрама, у которых, как отмечалось, наибольшие значения энергий связи атомов. Для них также наблюдается более пологий рост относительной энергии. Рост  $E_n/E_0$  с уменьшением  $E_0$ , совпадение кривых для Та и Re в отличие от рассеяния на W, соответственно сходство кривых для Ті и Cr в отличие от V свидетельствуют о влиянии энергии связи атомов мишени на процесс рассеяния, что говорит, по нашему мнению, о непарном характере взаимодействия низкоэнергетических ионов Cs<sup>+</sup> и K<sup>+</sup> при рассеянии на исследованных мишенях, для которых  $\mu$ >1.

Ранее нами было показано [5], что при рассеянии медленных ионов на мишенях с массами атомов, меньшими массы бомбардирующих ионов, когда  $\mu$ <1, при углах падения  $\phi$ =45° и рассеяния  $\psi$ =90°, также соответствующих углу зеркального отражения, наблюдалась аналогичная картина.

Дифференциальные спектры рассеяния ионов цезия на алюминии, кремнии, кобальте и никеле имели также куполообразную форму и, максимумы кривых претерпевали сдвиг в сторону больших энергий по мере уменьшения энергии первичных ионов. Но в отличие от результатов рассеяния на мишенях с µ>1, представленных в настоящей работе, наибольший сдвиг наблюдался при рассеянии на мишенях с наименьшими энергиями связи атомов мишеней.

На рис. 4 представлены зависимости относительной энергии, сохраняемой рассеянными ионами Е<sub>"</sub>/Е<sub>0</sub> в максимуме кривой распределения по энергиям ионов Cs<sup>+</sup>, рассеянных соответственно для пар Cs<sup>+</sup> $\rightarrow$ Al ( $\mu \approx 0,20$ ), Cs<sup>+</sup> $\rightarrow$  Si (µ $\cong$ 0,21), Cs<sup>+</sup>→ Co (µ $\cong$ 0,44) и Cs<sup>+</sup>→Ni (µ=0,44). Энергии связи атомов для алюминия E<sub>св</sub> =3,34 эВ/атом, кобальта Е<sub>св</sub> =4,387 эВ/атом, никеля E<sub>св</sub>=4,435 эВ/атом, кремния E<sub>св</sub>=4,64 эВ/атом. Отметим, что в этом случае зависимости также имеют характерный вид, доля сохраняемой энергии в максимумах энергетических распределений увеличивается с уменьшением Е<sub>0</sub>, причем кривая для алюминия с наименьшим значением энергии связи атомов мишени расположена ниже всех, т. е. доля сохраняемой при рассеянии энергии при этом наименьшая.



Рис. 4. Зависимости относительной энергии, сохраняемой рассеянными ионами E/E<sub>0</sub>, в максимуме энергетических распределений ионов Cs<sup>+</sup>, рассеянных поверхностями алюминия, кобальта, никеля и кремния, от начальной энергии

Сопоставление кривых (рис. 2-4) показывает, что при рассеянии медленных ионов наблюдается корреляция между энергией связи атомов мишеней и долей сохраняемой ионами энергии в максимумах энергетических распределений. Причем эта корреляция наблюдается как при рассеянии на мишенях с µ<1, так и при µ>1. В то же время мы видим, что при рассеянии медленных ионов на мишенях с малой атомной массой (µ<1) доля сохраняемой энергии наименьшая на мишенях с наименьшим значением энергии связи, а на мишенях с близкими к массе ионов атомными массами (µ>1) эта ситуация наблюдается на мишенях с наибольшим значением энергии связи. Кривые располагаются друг над другом, соответственно энергиям связи атомов мишеней, что говорит о влиянии энергии связи атомов мишеней на процесс рассеяния.

Таким образом, обнаруженная корреляция между относительной энергией, сохраняемой рассеянными ионами, и энергией связи атомов мишеней указывает, по нашему мнению, на многочастичный (групповой) характер взаимодействия, т.е. на взаимодействие налетающего иона одновременно с несколькими связанными между собой атомами поверхности. Из полученных результатов следует, что механизмы многочастичного (группового) взаимодействия должны быть различными для случаев прямого и обратного соотношения масс сталкивающихся частиц. Для объяснения полученных результатов необходимо проведение компьютерного моделирования процесса рассеяния низкоэнергетических ионов на поликристаллических поверхностях как в приближении парных столкновений, так и с учетом энергии связи атомов мишеней.

### ЛИТЕРАТУРА

1. *Mashkova E.S., Molchanov V.A.* Medium Energy Ion Reflection from Solids, North-Holland, Amsterdam, 1985.

2. Parilis E.S., Kishinevsky L.M., Turaev N.Yu. et al. Atomic Collisions on Solid Surfaces, North-Holland, Amsterdam, 1993.

3. *Машкова Е.С., Молчанов В.А.* Применение рассеяния ионов для анализа твёрдых тел. М.: Энергоатомиздат, 1995.

4. Евстифеев В.В., Крылов Н.М., Кудряшова Л.Б. Поверхность // Физика, химия, механика. 1992. № 5. С. 24.

5. Umarov F.F., Bazarbaev N.N., Kudryashova L.B., Krylov N.M. // Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. 2002. B 196. P. 155.

#### Резюме

Төменгі энергиядағы ( $E_0 = 30$ ё500 eV) Cs<sup>+</sup> иондарының Ta, W, Re поликристалдарымен, ал K<sup>+</sup> иондарының Ti, V, Cr поликристалдарымен әсерлесу нәтижесін эксперименталдық түрде талдай отырып, олардың шашырату механизмін анықтап, оны металдардың беттік қабатының қасиеттерін зерттеу үшін қолдану мәселесі қарастырылады.

#### Summary

The interaction of low-energy ions with solid surfaces has recently drawn considerable interest. This interest is defined by both the development of methods of diagnostics with use of ion beams, technology of ion-plasma deposition, ion beam epitaxy, ion implantation, and by necessity of full understanding of the mechanisms of the phenomena that follow the interaction of atomic particles with the solid surface.

<sup>1</sup>Казахстанско-Британский

университет им. Абая

технический университет;

<sup>2</sup>Казахский национальный университет

им. аль-Фараби;

<sup>3</sup>Казахский национальный педагогический

Поступила 9.02.07г.